

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 1 月 13 日 (13.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/003793 A1

- (51) 国際特許分類: G01R 1/073
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/009412
- (22) 国際出願日: 2004 年 7 月 2 日 (02.07.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-189949 2003 年 7 月 2 日 (02.07.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社日立製作所 (HITACHI, LTD.) [JP/JP]; 〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 春日部 進 (KA-SUKABE, Susumu) [JP/JP]; 〒2440817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 2 9 2 番地 株式会社日立製作所 生産技

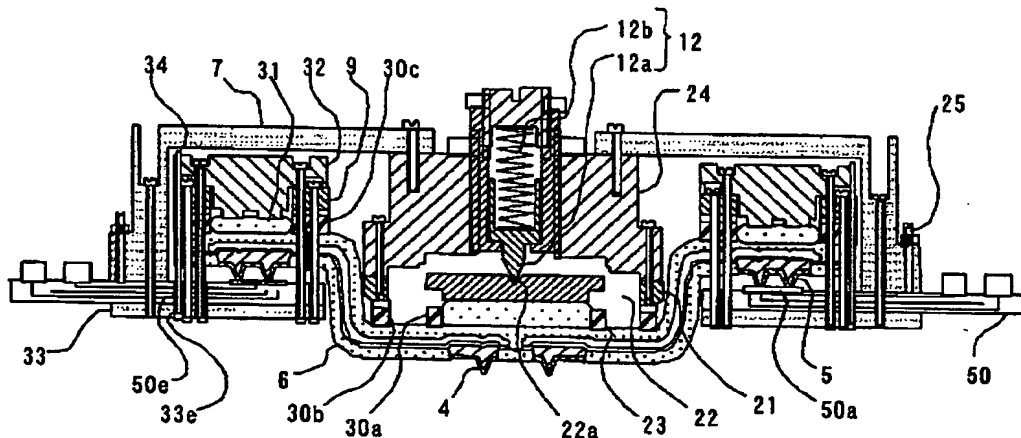
術研究所内 Kanagawa (JP). 山本 武志 (YAMAMOTO, Takeshi) [JP/JP]; 〒2440817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 2 9 2 番地 株式会社日立製作所 生産技術研究所内 Kanagawa (JP).

- (74) 代理人: 浅村 皓, 外 (ASAMURA, Kiyoshi et al.); 〒1000004 東京都千代田区大手町 2 丁目 2 番 1 号 新大手町ビル 3 3 1 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[続葉有]

(54) Title: PROBE CARD AND SEMICONDUCTOR TESTING DEVICE USING PROBE SHEET OR PROBE CARD AND SEMICONDUCTOR DEVICE PRODUCING METHOD

(54) 発明の名称: プローブカード及びプローブシートまたはプローブカードを用いた半導体検査装置および半導体装置の製造方法



(57) Abstract: A probe card and a probe sheet used in a testing method (production method) for a semiconductor device using the same has a first contact terminal for electric contact with the electrode of a testing subject object of narrow pitch, a wiring extending from the first contact terminal, and a second contact terminal for electric contact with the wiring, wherein the first and second contact terminals are formed by using an etched hole in a member having crystallinity and are lined with a metal sheet.

(57) 要約: プローブカードおよびそれを用いた半導体装置の検査方法 (製造方法) に使用されるプローブシートは、狭ピッチに形成された検査対象物の電極と電氣的に接触する第 1 の接触端子と、該第 1 の接触端子から引き回された配線と、該配線と電氣的に接触する第 2 の接触端子を有し、第 1 と第 2 の接触端子は結晶性を有する部材のエッチング穴を用いて形成し、金属シートで裏打ちされている。



SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。